

球差电镜测试 提供FIB,双喷减薄等制样服务

产品名称	球差电镜测试 提供FIB,双喷减薄等制样服务
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	报告语言:中英文可选 测试周期:7-10个工作日 服务:一站式检测服务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

球差校正透射电子显微镜是一种用于生物学、化学、物理学、农学领域的分析仪器。以场发射电子发射体发射电子，通过电磁透镜控制电子束汇集成很小的束斑并照射样品，同时利用球差校正器将电磁透镜中的球差

消除，可将图像的分辨率和分析能力提高到原子水平，实现原子级分辨率的成像和成分分析。用于材料中微结构的高空间分辨结构研究。

优势

- 1.配备电子束球差校正系统，使扫描透射像分辨率达到0.08nm，可实现原子水平的分析和成像。
- 2.配备了STEM明场和暗场探头以及EDS探测器，可获得HAADF和BF/ABF图像，以及进行线性扫描和面扫描分析。
- 3.电气稳定性和机械稳定性比传统透射电镜更高，同时配备热屏蔽和磁屏蔽系统，降低外部环境影响，提高设备稳定性。

样品要求

球差校正透射电子显微镜的制样要求和普通透射电子显微镜的制样要求基本一致（对电子束透明，厚度在100nm以下），样品需要干净、干燥、无污染、分散性较好。

球差电镜对样品的特殊要求如下：

- 1.粉末样品：常采用直径为3mm的微栅或超薄碳膜载网，根据样品颗粒大小选择合适的载网类型。
- 2.块体减薄样品或FIB样品，为直径3mm的圆形或半圆形样品。和普通透射样品的制样要求相同。

3.在测试前，务必先在普通透射电镜上筛选一下样品。

结果展示